

## ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОКИСЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ С УЧЕТОМ ТЕПЛООБМЕНА ИЗЛУЧЕНИЕМ

В. В. Калинчак, С. Г. Орловская, Т. В. Грызунова, Н. Н. Копыт

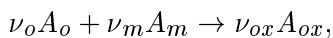
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, 65026 Одесса, Украина  
kalin@ntp.intes.odessa.ua

Исследовано влияние излучения на характеристики высокотемпературных и гистерезисных режимов окисления металлической частицы, на поверхности которой образуется оксидная пленка в конденсированном состоянии. Определены условия, при которых теплообмен излучением с холодными стенками реакционной установки приводит к уменьшению температуры горения, критических температур и толщин оксидной пленки — параметров, характеризующих зажигание, вынужденное и самопроизвольное потухание металлической частицы.

В настоящее время актуальны задачи создания новых полупроводниковых структур на основе частиц оксидов металлов, разработки ресурсосберегающих технологий, обеспечения пожаровзрывобезопасности перевозки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей от воздействия фрикционных искр, вызванных столкновением металлических частиц. В связи с применением дешевых оксидов металлов в аэрозольном катализе становится важным исследование взаимовлияния процессов окисления металлов и тепло- и массообмена с окружающими газами.

В работе [1] без учета теплообмена излучением изучались закономерности высокотемпературного окисления металлов и их самопроизвольное потухание в результате нарастания оксидной пленки до критического размера.

В данной работе с использованием метода [2] проанализировано влияние излучения на устойчивые и критические режимы высокотемпературного тепло- и массообмена и на кинетику гетерогенных химических реакций металлических частиц с газами. Изучено явление гистерезиса процесса окисления в зависимости от начальной толщины оксидной пленки. Исследован механизм самопроизвольного перехода из устойчивого высокотемпературного в низкотемпературный режим окисления частицы металла, на поверхности которой протекает химическая реакция



где  $A_o, A_m, A_{ox}$  — окислитель, металл и оксид;  $\nu_o, \nu_m, \nu_{ox}$  — соответствующие стехиометрические коэффициенты.

В качестве объекта исследования, как и в [1], выбраны металлы, рост оксидной пленки которых происходит согласно закону

$$W_{ox} = \rho_{ox} \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{M_{ox} \nu_{ox}}{M_o \nu_o} W_o, \\ W_o = \frac{k}{h} Y_{o,s} \rho_g, \quad h|_{t=0} = h_b,$$

где

$$Y_{o,s} = Y_{o,\infty} \left( \frac{k}{h\beta} + 1 \right)^{-1}, \\ k = k_0 \exp \left( -\frac{E}{RT} \right),$$

$$\beta = \frac{DN_u}{d}, \quad D = \frac{\lambda_g}{c_g \rho_g}, \quad \lambda_g = \lambda_{g,0} \left( \frac{T_*}{T_0} \right)^n,$$

$$\rho_g = \rho_{g,0} \left( \frac{T_0}{T_*} \right) \frac{p}{p_0}, \quad T_* = \frac{T + T_g}{2}.$$

Здесь  $W_{ox}, W_o$  — скорости гетерогенной химической реакции по оксиду и окислителю,  $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$ ;  $\rho_{ox}, \rho_g$  — плотности оксида и газа,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;  $\rho_{g,0}$  — плотность газа при температуре  $T_0 = 1273$  К и давлении  $p_0 = 1$  атм,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;  $h$  — толщина оксидной пленки, м;  $t$  — время, с;  $M_{ox}, M_o$  — молярные массы оксида и окислителя,  $\text{кг}/\text{моль}$ ;  $k$  — константа скорости реакции,  $\text{м}^2/\text{с}$ ;  $Y_{o,s}, Y_{o,\infty}$  — относительные массовые концентрации окислителя на поверхности частицы и в газе;  $\beta$  — коэффициент массообмена,  $\text{м}/\text{с}$ ;  $k_0$  — предэкспоненциальный множитель,  $\text{м}^2/\text{с}$ ;  $E$  — энергия активации, Дж/моль;  $T, T_g$  — температуры частицы

и газа, К;  $R$  — универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К);  $D$  — коэффициент диффузии окислителя в газовой смеси,  $\text{м}^2/\text{с}$  (число Льюиса полагалось равным единице);  $d$  — характерный размер частицы металла, м;  $\text{Nu}$  — критерий Нуссельта;  $\lambda_g$  — коэффициент теплопроводности газа, Вт/(м·К);  $c_g$  — удельная теплоемкость газа, Дж/(кг·К);  $\lambda_{g,0}$  — коэффициент теплопроводности газа при температуре  $T_0$  и давлении  $p_0$ , Вт/(м·К); для воздуха  $n = 0,75$  [3].

В случае теплопотерь излучением к холодным стенкам реакционной установки уравнение теплового баланса окисленной частицы металла имеет вид

$$c_m \rho_m V_m \frac{\partial T}{\partial t} = S_m (q_{ch} - q_c - q_r), \quad (3)$$

$$T|_{t=0} = T_b,$$

$$\begin{aligned} q_{ch} &= Q_o W_o, \quad q_c = \alpha(T - T_g) = \beta c_g \rho_g (T - T_g), \\ q_r &= \varepsilon \sigma (T^4 - T_w^4), \end{aligned} \quad (4)$$

где  $c_m$  — удельная теплоемкость металла, Дж/(кг·К);  $\rho_m$  — плотность металла, кг/м<sup>3</sup>;  $V_m$  — объем частицы металла, м<sup>3</sup>;  $S_m$  — поверхность частицы металла, м<sup>2</sup>;  $q_{ch}$ ,  $q_c$ ,  $q_r$  — плотности тепловых потоков соответственно за счет химической реакции, конвекции и излучения на стенки реакционной установки, Вт/м<sup>2</sup>;  $Q_o$  — тепловой эффект реакции по окислителю, Дж/(кг О<sub>2</sub>);  $\alpha$  — коэффициент теплообмена частицы, Вт/(м<sup>2</sup>·К);  $\varepsilon$  — степень черноты оксидной пленки;  $\sigma$  — постоянная Стефана — Больцмана, Вт/(м<sup>2</sup> · К<sup>4</sup>);  $T_w$  — температура стенок реакционной установки, К.

Из условия стационарности

$$q_{ch} = q_c + q_r,$$

используя (2) и (4), найдем зависимость толщины оксидной пленки от температуры, которая определяет устойчивые и критические режимы окисления металлической частицы:

$$h = \frac{k}{\beta} \left[ \frac{\beta Q_o Y_{o,\infty} \rho_g}{\alpha(T - T_g) + \varepsilon \sigma (T^4 - T_w^4)} - 1 \right]. \quad (5)$$

Из (5) видно, что максимальная температура частицы  $T_{\max}$  при учете теплопотерь излучением соответствуют условию  $h(T) = 0$ :

$$\beta Q_o Y_{o,\infty} \rho_g = \alpha(T_{\max} - T_g) + \varepsilon \sigma (T_{\max}^4 - T_w^4). \quad (6)$$

В случае пренебрежения теплообменом излучением максимальная температура частицы не зависит от коэффициентов тепло- и массообмена:

$$Q_o Y_{o,\infty} = c_g (T_{\max} - T_g). \quad (7)$$

Докажем, что экстремумы функции  $h(T)$  определяют зажигание и потухание металлической частицы.

Совокупность стационарных устойчивых и критических состояний, образующихся в результате изменения толщины оксидной пленки и, следовательно, температуры, описывается дифференциальным соотношением

$$\begin{aligned} \frac{\partial q_{ch}}{\partial T} dT + \frac{\partial q_{ch}}{\partial h} dh &= \frac{\partial(q_c + q_r)}{\partial T} dT + \\ &+ \frac{\partial(q_c + q_r)}{\partial h} dh. \end{aligned} \quad (8)$$

Выделим из всех стационарных состояний критические состояния, соответствующие условию касания кривых  $q_{ch}(T)$  и  $(q_c + q_r)(T)$ :

$$\frac{\partial q_{ch}}{\partial T} = \frac{\partial(q_c + q_r)}{\partial T}.$$

Для этого разделим обе части соотношения (8) на  $dT$  и представим его в виде

$$\frac{\partial q_{ch}}{\partial T} - \frac{\partial(q_c + q_r)}{\partial T} = - \frac{\partial h}{\partial T} \left( \frac{\partial q_{ch}}{\partial h} \right). \quad (9)$$

Здесь  $\frac{\partial q_{ch}}{\partial h} \neq 0$ . Например, для случая зажигания в кинетической области

$$\frac{\partial q_{ch}}{\partial h} = -Q_o \frac{k}{h^2} \rho_g Y_{o,\infty} < 0.$$

Из (9) следует, что критические условия зажигания (обозначено индексом  $i$ ) и потухания (индекс  $e$ ) частицы характеризуются экстремумами функции  $h(T)$ , т. е.

$$\left. \frac{\partial h}{\partial T} \right|_{i,e} = 0.$$

Для зажигания — это точка минимума на кривой  $h(T)$ :

$$\frac{\partial^2 q_{ch}}{\partial T^2} > \frac{\partial^2(q_c + q_r)}{\partial T^2}, \quad \left. \frac{\partial^2 h}{\partial T^2} \right|_i > 0,$$

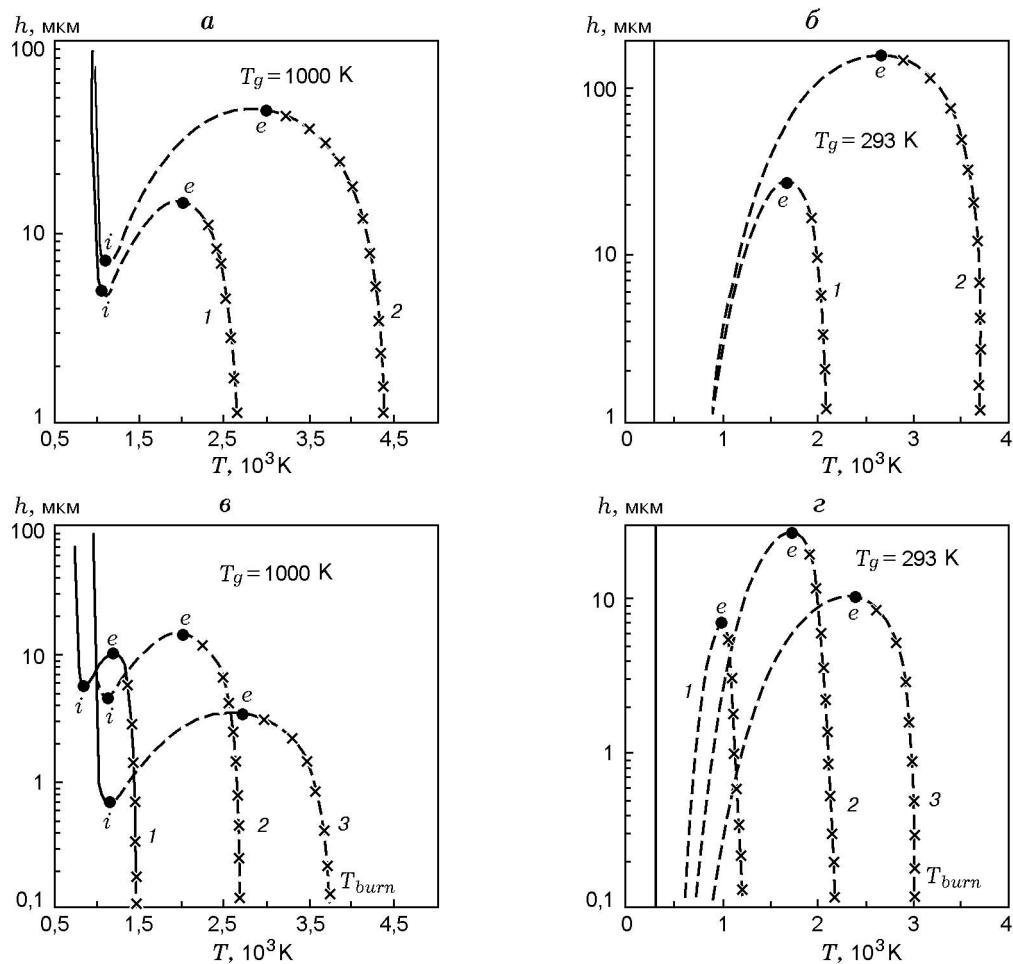


Рис. 1. Зависимости толщины оксидной пленки от стационарной температуры металлической частицы при различных температурах воздуха:

*a, б:* \$d = 100 \mu\text{m}\$, 1 — с учетом теплообмена излучением (\$T\_w = 293\$ К), 2 — без учета теплообмена излучением;

*в, г:* с учетом теплообмена излучением (\$T\_w = 293\$ К), \$d = 2000\$ (1), \$100\$ (2), \$10 \mu\text{m}\$ (3); сплошные кривые — низкотемпературные устойчивые состояния, кривые с крестиками — высокотемпературные; точки *i* — критические условия воспламенения частиц, точки *e* — потухания частиц

для потухания — точка максимума:

$$\frac{\partial^2 q_{ch}}{\partial T^2} < \frac{\partial^2 (q_c + q_r)}{\partial T^2}, \quad \left. \frac{\partial^2 h}{\partial T^2} \right|_e < 0.$$

На рис. 1 приведены рассчитанные по уравнению (5) стационарные зависимости \$h(T)\$ с учетом и без учета теплопотерь излучением к холодным стенкам реакционной установки для различных диаметров частиц железа при температурах воздуха \$T\_g = 293\$ и \$1000\$ К и температуре стенок реакционной установки, равной комнатной. Предполагается, что реакция частиц железа с кислородом воздуха протекает согласно уравнению \$2\text{Fe} + \text{O}\_2 \rightarrow 2\text{FeO}\$. Расчеты

проведены при следующих параметрах: \$Y\_{o,\infty} = 0,23\$, \$p = 1\$ атм, \$\text{Nu} = 2\$, \$E = 81640\$ Дж/моль, \$k\_0 = 5,6 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2/\text{с}\$, \$Q\_o = 16,5 \cdot 10^6\$ Дж/(кг \$\text{O}\_2\$), \$\lambda\_{g,0} = 8,19 \cdot 10^{-2}\$ Вт/(м\$\cdot\$К), \$\rho\_{g,0} = 0,277 \text{ кг}/\text{м}^3\$, \$c\_g = 1110\$ Дж/(кг\$\cdot\$К), \$\varepsilon = 0,8\$ [4].

Низкотемпературные и высокотемпературные устойчивые состояния характеризуются монотонным ростом температуры частицы при уменьшении толщины оксидной пленки. По достижении критических значений \$h\_i\$, \$T\_i\$ происходит зажигание частицы — скачкообразный переход в высокотемпературный режим. С ростом \$h\$ температура металлической частицы уменьшается, и при \$h = h\_e\$, \$T = T\_e\$

Таблица 1  
 Критические значения толщин оксидной пленки,  
 период индукции ( $t_{ind}$ ) и  
 длительность высокотемпературной стадии  
 ( $t_{burn}$ ) (время горения) для частицы  
 диаметром 100 мкм ( $T_g = 1000$  К,  $T_w = 293$  К)

Уравнения	$h_i$ , мкм	$h_e$ , мкм	$t_{ind}$ , с	$t_{burn}$ , с
(1)–(4)	2,5	23,3	0,11	0,18
(5)	4,6	14,5	—	—

происходит потухание — скачкообразный переход в низкотемпературное состояние. Таким образом, минимум на зависимости  $h(T)$  характеризует зажигание частицы ( $h_i$ ,  $T_i$ ), а максимум — ее потухание ( $h_e$ ,  $T_e$ ). Зависимость температуры горения частицы  $T_{burn}$  от толщины оксидной пленки определяется высокотемпературной ветвью кривой  $T(h)$ .

В интервале  $h_i < h_b < h_e$  наблюдается гистерезисная зависимость температуры частицы и, следовательно, скорости химического реагирования от начальной толщины оксидной пленки. Штриховая линия, соединяющая максимум (потухание) и минимум (зажигание) на зависимости  $h(T)$ , характеризует критические значения  $h_b$  и  $T_b$ . Переход в высокотемпературный режим в области  $h_i < h_b < h_e$  осуществляется при начальной температуре частицы выше критического значения  $T_b$ .

На рис. 1, б, г приведены зависимости  $h(T)$  при учете теплообмена излучением для различных значений диаметра частиц. Из рис. 1, в видно, что увеличение диаметра частицы приводит вначале к росту толщины  $h_e$ , а затем к ее уменьшению. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и для  $h_i$ . Рост критических значений толщин оксидной пленки объясняется тем, что с увеличением диаметра частицы уменьшается теплоотвод от частицы. Поэтому критические переходы осуществляются при меньшем тепловыделении, что регулируется увеличением толщин  $h_i$  и  $h_e$ . Следует отметить, что расчеты по нестационарной модели (уравнения (1)–(4)) дают для  $h_i$  заниженные, а для  $h_e$  повышенные значения по сравнению с рассчитанными по уравнению (5) (табл. 1).

Приведенные на рис. 1, б, г зависимости  $h(T)$ , полученные при комнатной температуре, показывают, что переход в высокотемпературный режим возможен в том случае, если при данной начальной толщине оксидной пленки

начальная температура частицы будет больше критического значения (штриховая линия). Полученные значения максимальных температур горения фрикционных искр ( $T_{burn}$ ) с учетом теплопотерь излучением (см. рис. 1, г) на 15 % завышены по сравнению с экспериментальными данными [5]. Это можно объяснить тем, что не учитывалось плавление металлических частиц.

Температура горения  $T_{burn}$  с увеличением диаметра частицы уменьшается (см. рис. 1, в, г) вследствие роста теплопотерь излучением к холодным стенкам реакционной установки и перехода химической реакции в диффузионный режим  $\beta \ll k/h$  (табл. 2), где

$$q_{ch} = Q_o \frac{DNu}{d} Y_{o,\infty} \rho_g.$$

Таким образом, увеличение диаметра частицы  $d$  вызывает уменьшение величины  $q_{ch}$  и, следовательно, температуры горения частицы.

Проведем анализ влияния условий тепло- и массообмена, задаваемых отношением характерного размера  $d$  окисленной частицы металла к критерию Нуссельта Nu, на критические значения толщин оксидной пленки и соответствующие критические температуры частицы ( $h_i$ ,  $h_e$ ,  $T_i$ ,  $T_e$ ) с учетом и без учета теплообмена излучением с холодными стенками установки (рис. 2). С увеличением параметра  $d/Nu$  критические значения  $h_i$  и  $h_e$  возрастают, достигают максимума (точки  $C_i$  и  $C_e$ ), а затем уменьшаются (см. рис. 2, а). При небольших значениях  $d/Nu$  велика роль теплообмена частицы с газом и критические температуры  $T_i$  и  $T_e$  больше  $T_g$  (см. рис. 2, б). Увеличение параметра  $d/Nu$  приводит к падению коэффициента теплоотдачи ( $\alpha = \lambda_g Nu/d$ ), что, естественно, вызывает увеличение толщин  $h_i$  и  $h_e$ , при которых происходят критические переходы. При этом растет роль теплопотерь излучением, что приводит к понижению критических температур частицы. Одновременно с ростом отношения  $d/Nu$  существенно уменьшается коэффициент массообмена ( $\beta = DNu/d$ ) (см. табл. 2). В результате значения  $h_i$  и  $h_e$  достигают максимумов при некотором значении  $(d/Nu)_{max}$ . Дальнейшее увеличение параметра  $d/Nu$  вызывает уменьшение плотности теплового потока, так как  $T_i < T_g$ . Следовательно, зажигание частицы произойдет при меньших значениях  $h_i$ . В случае потухания частицы увеличение  $d/Nu$  вызывает уменьшение плотности хи-

Таблица 2

Влияние диаметра частицы на значения параметров  $k/h$ ,  $\beta$  и  $k/h\beta$  при зажигании, потухании и горении частицы ( $T_g = 1000$  К,  $T_w = 293$  К)

Режим	$d = 10$ мкм			$d = 100$ мкм			$d = 2000$ мкм		
	$k/h$	$\beta$	$k/h\beta$	$k/h$	$\beta$	$k/h\beta$	$k/h$	$\beta$	$k/h\beta$
Зажигание	1,5	34,9	$4,2 \cdot 10^{-2}$	0,16	3,5	$4,7 \cdot 10^{-2}$	$1,2 \cdot 10^{-2}$	0,17	$6,7 \cdot 10^{-2}$
Потухание	37	34,9	1,06	2,86	3,5	0,8	0,16	0,17	0,9
Горение при $h \approx 0,1$ мкм	$4,2 \cdot 10^3$	34,9	121	$2,1 \cdot 10^3$	3,5	597	189	0,17	$1,1 \cdot 10^3$

Примечание. Отношение  $k/h$  измеряется в м/с,  $\beta$  — м/с.

мического тепловыделения, так как уменьшается коэффициент массообмена. Поэтому частица потухает при меньшем значении  $h_e$ . Из табл. 2 видно, что зажигание происходит в кинетическом режиме ( $k/h \ll \beta$ ), а потухание — в переходном ( $k/h \cong \beta$ ).

Максимальное критическое значение толщины оксидной пленки  $h_{i,\max}$  и соответствующие диаметр и температуру частицы, при которых возможен переход в высокотемпературный режим при заданных температурах газа и стенок установки, можно найти из условий

$$\begin{aligned} \frac{\partial q_{ch}}{\partial \beta} &= \frac{\partial(q_c + q_r)}{\partial \beta}, \\ \frac{\partial q_{ch}}{\partial T} &= \frac{\partial(q_c + q_r)}{\partial T}. \end{aligned} \quad (10)$$

Условие стационарности при протекании химической реакции в кинетической области с учетом (1), (2), (4) представим в виде

$$\begin{aligned} Q \frac{k_0}{h} Y_{o,\infty} \rho_g \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) &= \\ &= \beta c_g \rho_g (T - T_g) + \varepsilon \sigma (T^4 - T_w^4). \end{aligned} \quad (11)$$

Используя (10), получим

$$0 = c_g \rho_g (T - T_g),$$

$$\begin{aligned} Q \frac{k_0}{h} Y_{o,\infty} \rho_g \frac{E}{RT^2} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) &= \\ &= \beta c_g \rho_g + 4 \varepsilon \sigma T^3. \end{aligned} \quad (12)$$

Итак, в точке максимума зависимости  $h_i(d/\text{Nu})$  критические температуры частицы и газа равны ( $T_i = T_g$ ).

Подставляя  $T_i = T_g$  в (11) и (12), получим значение характерного размера частицы, выше которого переход в высокотемпературный режим осуществляется при меньших толщинах оксидной пленки:

$$\left(\frac{d}{\text{Nu}}\right)_{i,\max} = \frac{\lambda_g R}{\varepsilon \sigma (T_g^4 - T_w^4)} \left[1 - \left(\frac{T_w}{T_g}\right)^4 - \frac{4RT_g}{E}\right]^{-1}. \quad (13)$$

Этому размеру соответствует толщина оксидной пленки

$$h_{i,\max} = \frac{Q_o Y_{o,\infty} \rho_g k_0}{\varepsilon \sigma (T_g^4 - T_w^4)} \exp\left(-\frac{E}{RT_g}\right). \quad (14)$$

Расчетом по формулам (13), (14) при  $T_g = 1000$  К,  $T_w = 293$  К получены значения  $h_{i,\max} = 8,9$  мкм,  $(d/\text{Nu})_{i,\max} = 262$  мкм, хорошо согласующиеся с результатами, представленными на рис. 2,а ( $h_{i,\max} = 8,5$  мкм,  $(d/\text{Nu})_{i,\max} = 258$  мкм). Выражение (13) коррелирует с критерием радиационного теплообмена, полученным в работе [6].

В случае пренебрежения радиационными теплопотерями максимумы на зависимостях  $h_i(d/\text{Nu})$  и  $h_e(d/\text{Nu})$  отсутствуют (см. рис. 2,б). С ростом параметра  $d/\text{Nu}$  наблюдается монотонное увеличение толщин  $h_i$  и  $h_e$ . Критические температуры частицы, характеризующие ее зажигание и потухание, при отсутствии теплопотерь излучением не зависят от величины  $d/\text{Nu}$  (см. рис. 2,б) и определяются выражениями

$$T_i = T_g + \frac{RT_g^2}{E},$$

$$T_e = T_{\max} - \frac{RT_{\max}^2}{E} \left(1 + \frac{Q_o Y_{o,\infty} R}{c_g E}\right)^{-1},$$

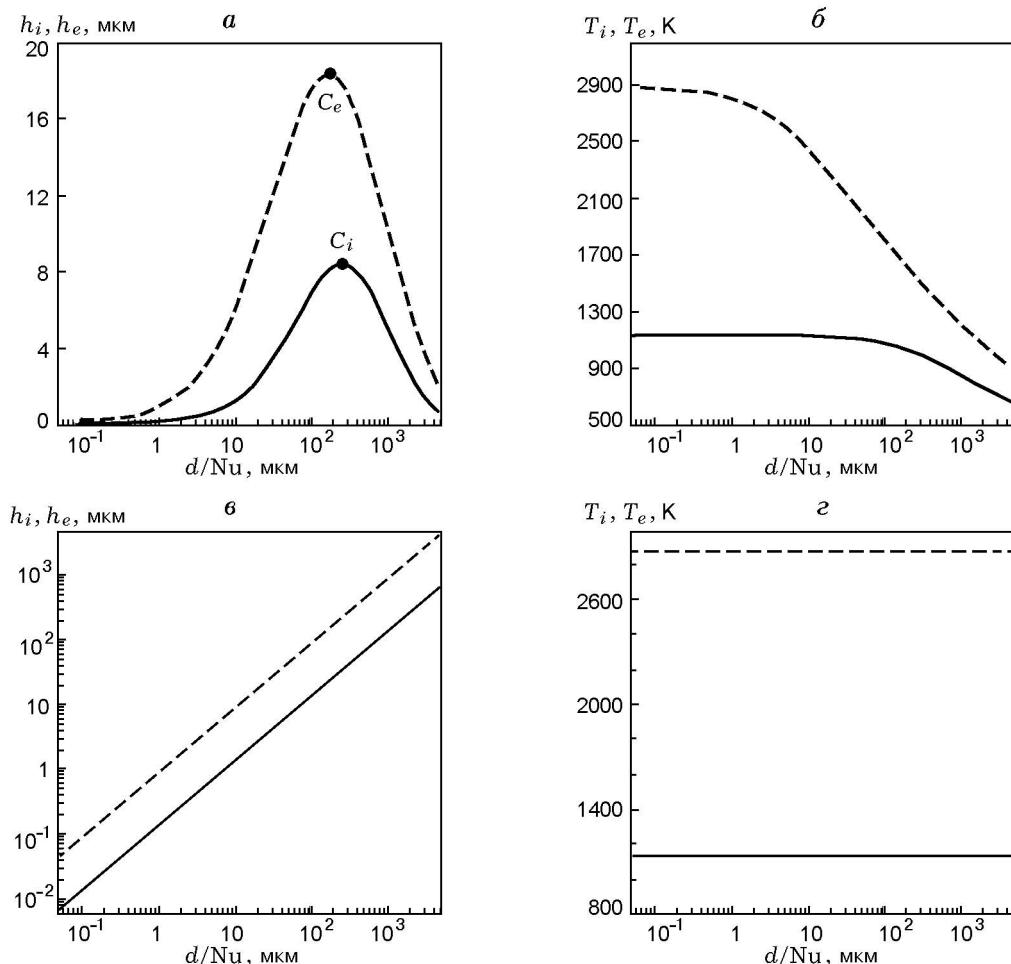


Рис. 2. Зависимость критических значений температур и толщин оксидной пленки, определяющих зажигание и потухание частицы, от величины  $d/\text{Nu}$ :

$T_g = 1000 \text{ K}$ ;  $a, b$  — с учетом теплообмена излучением ( $T_w = 293 \text{ K}$ );  $c, d$  — без учета теплообмена излучением; сплошные линии — зажигание, штриховые — потухание

где максимальная температура находится из уравнения (7).

Рассчитанные по этим формулам значения  $T_i = 1102 \text{ K}$  и  $T_e = 2946 \text{ K}$  удовлетворительно согласуются с результатами, представленными на рис. 2,  $c$ :  $T_i = 1137 \text{ K}$ ,  $T_e = 2883 \text{ K}$ . Расчеты критических температур частицы, характеризующих ее зажигание и потухание, с учетом теплообмена излучением показывают, что их значения уменьшаются с ростом величины  $d/\text{Nu}$  (см. рис. 2,  $b$ ), что, в свою очередь, вызывает уменьшение соответствующих критических толщин оксидной пленки.

Таким образом, установлены условия, при которых теплообмен излучением с холодными

стенками реакционной установки снижает температуру горения и приводит к уменьшению критических толщин оксидной пленки (зажигание, потухание) с ростом характерного размера частицы.

## ЛИТЕРАТУРА

- Марголин А. Д., Посвянский В. С. Критические условия высокотемпературного окисления металлов // Физика горения и взрыва. 1998. Т. 34, № 4. С. 30–33.
- Калинчак В. В., Орловская С. Г., Мандель А. В. Устойчивые и критические режимы тепломассообмена углеродной частицы в по-

- ле лазерного излучения с учетом стефановского течения // Теплофизика высоких температур. 1998. Т. 36, № 5. С. 746–753.
3. **Основы практической теории горения** / Под ред. В. В. Померанцева. Л.: Энергоатомиздат, 1986.
4. **Самсонов Г. В.** Физико-химические свойства окислов: Справочник. М.: Металлургия, 1978.
5. **Иващенко П. Ф., Меньшаков В. А., Толчинский В. Н.** Исследование механизма искробразования и поджигающей способности фрикционных искр // Взрывобезопасность в строительстве. М.: МИСИ, 1983. С. 34–44.
6. **Хайкин Б. И., Блошенко В. Н., Мержанов А. Г.** О воспламенении частиц металлов // Физика горения и взрыва. 1970. Т. 6, № 4. С. 474–488.

---

*Поступила в редакцию 8/II 2001 г.,  
в окончательном варианте — 15/VIII 2001 г.*